

報道関係 各位

株式会社アドバンテスト

## Test & Measurement World 誌が選ぶ 「2008 The Best in Test」を受賞



株式会社アドバンテスト(本社:東京都千代田区 社長:丸山利雄)は、このたび、電子機器のテストや計測に関する米国の専門誌「Test & Measurement World」が選ぶ「2008 Best in Test」を受賞しました。

同賞は、リード・ビジネス・インフォメーション(Reed Business Information)社より出版される Test & Measurement World 誌の編集部が、電子機器のテストや計測の分野において技術革新に大きく貢献した製品やサービスを年に一度選定し、授賞を行なうものです。今回、当社は、テスト・システム「T2000 LS メインフレーム」とダイナミック・テスト・ハンドラ「M4841」の組み合わせによるテスト・セル・ソリューションが、コンシューマー向けの SoC デバイス試験において、最大同時測定 16 個、18,500 個 / 時間という高スループット試験を実現した点が評価され、初めての同賞受賞にいたしました。なお、今年度の受賞企業は当社を含めた 12 社で、日本企業では当社のみでの受賞となります。

今回受賞しましたテスト・セル・ソリューションを構成する「T2000 LS メインフレーム」は、OPENSTAR®規格に基づいて設計され、測定デバイスの種類に合わせて試験モジュールをフレキシブルに組み合わせていただくことが可能ですので、最適構成で低コストなテスト環境を実現いたします。また、「M4841」は、デバイスを最大 16 個同時に 18,500 個 / 時間の高スループット搬送可能なだけでなく、ソフト・タッチ・ハンドリング機構を搭載し、搬送時のデバイス破損要因を極力抑えることが可能です。

当社は今後も、多様化する顧客のテスト・ニーズに対して、革新的な試験装置や搬送装置、デバイス・インターフェイス、ソフトウェア、顧客サポート等を提供し、顧客満足の向上に努めてまいります。

OPENSTAR®は Semiconductor Test Consortium, Inc の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

本ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な事象により予告無く変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。